

18 cm

Medición de parámetros ópticos en películas de $a\text{-Si}_{1-x}\text{C}_x\text{:H}$

*H. Rojas P. *, A. Torres J., F.-J. Renero C.*

Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica,

Luis Enrique Erro #1 Apartado Postal 51 y 216, Tonantzintla Puebla, México

Dispositivos basados en películas de $a\text{-Si}_{1-x}\text{C}_x\text{:H}$ (carburo de silicio hidrogenado) tales como celdas solares, presentan un coeficiente de absorción muy alto, a su vez, los dispositivos emisores de luz requieren materiales con altos coeficientes de absorción para su fabricación, es por esto que estamos interesados en la medición de parámetros ópticos (coeficiente de absorción, ancho de banda, índice de refracción) de esta película y utilizar éstos como un método de selección de la película para la fabricación de dispositivos emisores de luz. La medición de los parámetros se realiza mediante un programa de computo basado en el método de Swanapoel. Presentaremos un análisis de resultados obtenidos de películas de carburo de silicio depositadas bajo diferentes condiciones.

* Becario CONACyT

e-mail: hrojasp@susu.inaoep.mx

12 cm